

МЕЖДОЛИННОЕ РАСЩЕПЛЕНИЕ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СПЕКТРЕ ДВУМЕРНЫХ ЭЛЕКТРОНОВ НА ПОВЕРХНОСТИ (100) КРЕМНИЯ

И.В.Кукушкин

Методом оптической спектроскопии определено междолинное расщепление в энергетическом спектре двумерных электронов в Si – МДП структурах. Показано, что в перпендикулярном магнитном поле это расщепление увеличивается почти в 10 раз из-за эффектов межэлектронного взаимодействия.

1. Нижайшая размерно квантованная подзона двумерных электронов на поверхности (100) кремния сформирована из состояний, принадлежащих двум долинам зоны проводимости, лежащим на оси [100]¹. Из эксперимента следует, что это долинное вырождение в магнитном поле (H), перпендикулярном 2D-слою, снимается, что проявляется, например, в осцилляциях Шубникова – де Гааза². Существует несколько теорий^{3–8}, имеющих целью объяснить этот экспериментальный факт. В работах^{3–6} показано, что долинное расщепление, вычисленное без привлечения эффектов межэлектронного ($e - e$) взаимодействия (ΔE_V^0), определяется затворным полем, т.е. пропорционально концентрации 2D-электронов n_s :

$$\Delta E_V^0 = \alpha (\partial V / \partial Z) \sim n_s, \quad (1)$$

где $\alpha = \text{const}$, $(\partial V / \partial Z)$ – градиент потенциала. В работах^{7,8} отмечалось, что в перпендикулярном магнитном поле долинное расщепление должно значительно усиливаться за счет вклада ΔE_V^* , возникающего из-за эффектов взаимодействия 2D-электронов. Таким образом, для полного междолинного расщепления (ΔE_V) имеем:

$$\Delta E_V = \Delta E_V^0 + \Delta E_V^*. \quad (2)$$

Важно, что вклады ΔE_V^0 и ΔE_V^* по-разному зависят от H , n_s и фактора заполнения $\nu = hn_s / eH$, поэтому необходимо их экспериментально разделять и исследовать отдельно.

2. Величина ΔE_V экспериментально определялась из анализа особенностей осцилляций магнитопроводимости^{9–11} и контактной разности потенциалов¹². В указанных работах величина расщепления определялась косвенным образом с использованием подгоночных параметров и предположений, требующих специального обоснования. Недавно в работах^{13–15} была обнаружена излучательная рекомбинация 2D-электронов на поверхности (100) кремния с фотовозбужденными дырками. Как было доказано в¹⁴, спектральное распределение этого излучения прямым образом отражает энергетический спектр 2D-электронов. Так в магнитном поле, перпендикулярном 2D-слою, наблюдается картина уровней Ландау, которая изменялась при повороте поля в соответствии с изменением нормальной компоненты H ¹⁴. Применение методов оптической спектроскопии позволяет прямым образом измерить ΔE_V как энергетический интервал между соответствующими линиями в спектрах излучательной

рекомбинации. Этот метод также дает возможность разделить вклады ΔE_V^0 и ΔE_V^* в междолинном расщеплении и отдельно исследовать их зависимости от n_S , H , ν .

3. В работе исследовались два МДП-транзистора с максимальной подвижностью $2D$ -электронов при $T = 1,6 \text{ K}$ $\mu = 3,1 \cdot 10^4 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$ и $1,8 \cdot 10^4 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$. Неравновесные электронно-дырочные пары генерировались через полупрозрачный затвор с помощью аргонового лазера. Характерная плотность мощности составляла $\sim 10^{-3} \text{ Вт}/\text{см}^2$. Регистрация излучения производилась с помощью охлаждаемого ФЭУ-62 в режиме счета фотонов с последующим накоплением сигнала. Одновременно с оптическими проводились магнитотранспортные измерения. Остальные детали эксперимента можно найти в¹⁵.

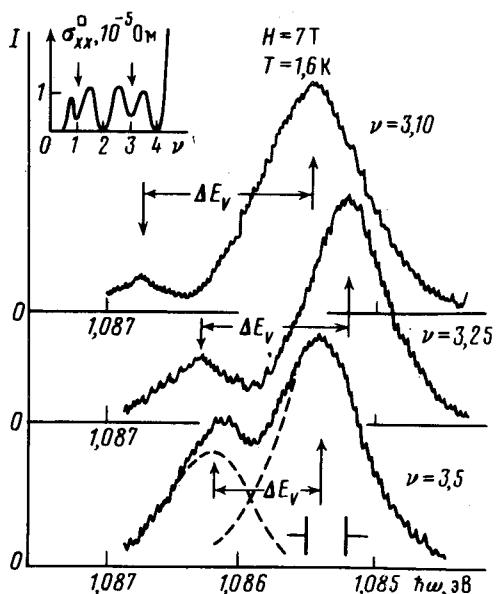


Рис. 1

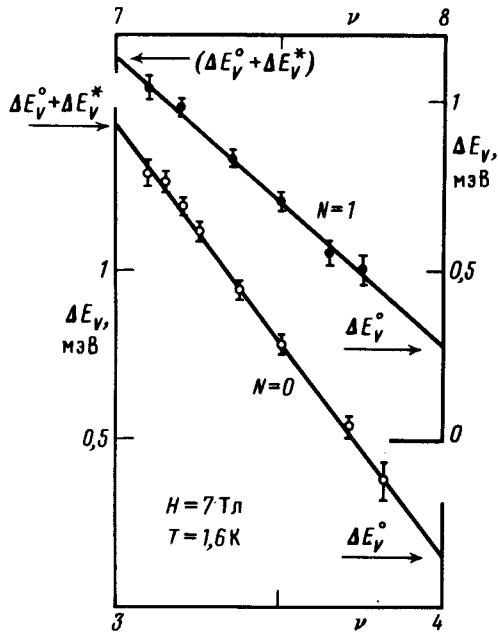


Рис. 2

Рис. 1. Спектры излучательной рекомбинации $2D$ -электронов с фотовозбужденными дырками, измеренные при $H = 7 \text{ Тл}$, $T = 1,6 \text{ К}$, $W = 10^{-3} \text{ Вт}/\text{см}^2$ и различных значениях фактора заполнения $\nu: 3,1; 3,25; 3,5$. ΔE_V – отвечает величине междолинного расщепления. На вставке показана зависимость $\sigma_{xx}^0(\nu)$, измеренная одновременно при тех же параметрах H , T , W . Минимумы σ_{xx}^0 , показанные стрелками, отвечают междолинному расщеплению

Рис. 2. Изменение величины ΔE_V , определенной методом оптической спектроскопии, от фактора заполнения ν при $H = 7 \text{ Тл}$, $T = 1,6 \text{ К}$ для уровней Ландау с номерами $N=0$ (светлые значки) и $N=1$ (темные значки)

4. На рис. 1 приведены зависимости $\sigma_{xx}(\nu)$ (на вставке) и спектры излучательной рекомбинации $2D$ -электронов, измеренные при $H = 7 \text{ Тл}$ и $T = 1,6 \text{ К}$. Стрелками на зависимости $\sigma_{xx}(\nu)$ показаны минимумы σ_{xx} при нечетных целых $\nu = \nu^*$, отвечающие междолинному расщеплению. При $\nu = 3,0$ в спектре рекомбинации наблюдается одна линия, связанная с рекомбинацией $2D$ -электронов из нижней электронной долины, имеющих проекцию спина $S_Z = -1/2$ и принадлежащих основному уровню Ландау ($N=0$) (при низких температурах ($T \cong 1,6 \text{ K}$) в рекомбинации участвуют лишь дырки из основного состояния с $J_Z = -3/2$ и оптические переходы с участием электронов с $S_Z = -1/2$ запрещены, а соответствующие линии излучения не наблюдаются¹⁴). При $\nu > 3$ начинает заполняться следующая электронная долина и в спектре рекомбинации появляется новая линия, относительная интенсивность которой отвечает отклонению ν от 3. Энергетический интервал между линиями отвечает междолинному расщеплению ΔE_V (см. рис. 1). Отметим, что даже в тех случаях, когда ΔE_V ста-

новится меньше, чем ширина линий и линии не разрешаются полностью, величина ΔE_V определяется с хорошей точностью, поскольку известна форма линий (измеренная при $2 < \nu < 3$), а также отношение их интенсивностей для заданного ν . Таким образом, методы оптической спектроскопии позволяют не только прямым способом определить ΔE_V , но и измерить зависимость $\Delta E_V(\nu)$.

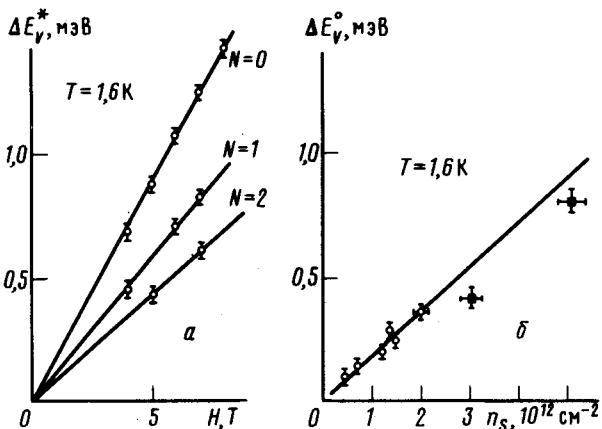


Рис. 3. *a* – Зависимости величины $\Delta E_V^*(\nu^*)$ от магнитного поля, измеренные для различных номеров уровней Ландау при $T = 1,6$ К; *б* – зависимость величины ΔE_V^0 от концентрации 2D-электронов n_S , измеренная при $T = 1,6$ К (светлые значки). Темные значки отвечают результатам работы ¹¹, прямая соответствует теории ⁴ и получена при $n_d = 0$, поскольку в условиях фотоизлучения слой обеднения отсутствует

На рис. 2 показаны зависимости $\Delta E_V(\nu)$, измеренные при $H = 7$ Тл, $T = 1,6$ К для двух уровней Ландау с $N=0$ и $N=1$. Видно, что величина ΔE_V максимальна при $\nu = \nu^* = 3, 5, \dots$, причем абсолютное значение ΔE_V , измеренное методом оптической спектроскопии, существенно превышает значения, полученные другими методами в работах ⁹⁻¹². Кроме того видно, что ΔE_V уменьшается при отклонении ν от ν^* , по мере заполнения очередной долины. Такое поведение $\Delta E_V(\nu)$ отвечает механизму долинного расщепления, основанному на $e - e$ взаимодействии и противоречит концепции неперенормированного ΔE_V^0 . Действительно, согласно ⁷, усиление ΔE_V возникает из-за того, что электронам из различных долин, имеющим разные квантовые числа, не запрещается принципом Паули располагаться близко друг к другу, из-за чего и возникает дополнительное отталкивание, которое приводит к увеличению ΔE_V^0 на ΔE_V^* . Эффект увеличения ΔE_V аналогичен увеличению g -фактора 2D-электронов за счет $e - e$ взаимодействия ^{16,17}. В рамках экранированного приближения Хартри – Фока ΔE_V^* определяется выражением ⁷:

$$\Delta E_V^* = (\nu_1 - \nu_2) \sum_q [L_N^0 (l^2 q^2 / 2) \exp(-l^2 q^2 / 2)]^2 V(q) / \epsilon(q), \quad (3)$$

где ν_1, ν_2 – факторы заполнения нижней и верхней долин, $V(q)$ – фурьеобраз $e - e$ взаимодействия, $\epsilon(q)$ – статическая диэлектрическая проницаемость, l – магнитная длина, L_N^0 – присоединенные полиномы Лагерра. Из формулы (3) видно, что величина ΔE_V^* максимальна в случае, когда полностью заполнена одна долина и пуста другая (т.е. при $\nu = \nu^* = 1, 3, 5, \dots$) и обращается в ноль при равном заполнении (при $\nu = \nu^0 = 2, 4, 6, \dots$). Такая зависимость $\Delta E_V^*(\nu)$ полностью объясняет экспериментальные данные, представленные на рис. 2 и позволяет определить раздельно величины ΔE_V^* и ΔE_V^0 , поскольку при $\nu \rightarrow \nu^0$, $\Delta E_V^* \rightarrow 0$ и $\Delta E_V \rightarrow \Delta E_V^0$ (см. рис. 2). Проведенные исследования показали, что ΔE_V^0 не зависит от H, N и определяется только n_S . В то же время, величина ΔE_V^* сильно зависит от H, N , а также температуры и ширины уровня Ландау. Зависимости ΔE_V^* от H для разных N представлены на рис. 3, *a*, а зависимость ΔE_V^0 от n_S – на рис. 3, *б*. На рис. 3, *б* показаны также точки из работы ¹¹, в которой определялись величины ΔE_V^0 , так как измерения проводились при больших n_S и N .

5. Таким образом, в настоящей работе использование метода оптической спектроскопии позволило: 1) прямым способом определить ΔE_V без подгоночных параметров и предположений, 2) показать, что при $N=0$ и $N=1$ долинное расщепление испытывает очень сильное увеличение (почти в 10 раз) за счет $e - e$ взаимодействия, 3) измерить зависимость $\Delta E_V(\nu)$,

4) разделить вклады ΔE_V^0 и ΔE_V^* в полной величине ΔE_V , 5) измерить зависимости ΔE_V^* от H для различных N , 6) показать, что ΔE_V^0 не зависит от H и N , а определяется только n_S .

В заключение автор выражает благодарность В.Б.Тимофееву за полезные обсуждения.

Литература

1. *Ando T., Fowler A.B., Stern F.* Rev. Mod. Phys., 1982, **54**, 437.
2. *Fowler A.B., Fang F.F., Howard W.E., Stiles P.J.* Phys. Rev. Lett., 1966, **16**, 901.
3. *Kummel R.* Z. Physik, 1975, **B22**, 223.
4. *Ohkawa F.J., Uemura Y.* J. Phys. Soc. Japan, 1977, **43**, 907, 917.
5. *Sham L.J., Nakayama M.* Surf. Sci., 1978, **73**, 272.
6. *Sham L.J., Nakayama M.* Phys. Rev., 1979, **B20**, 734.
7. *Ohkawa F.J., Uemura M.* J. Phys. Soc. Japan, 1977, **43**, 925.
8. *Rauh Y., Kummel R.* Surf. Sci., 1980, **98**, 370.
9. *Kohler H., Roos M., Landwehr G.* Solid State Comm., 1978, **27**, 955.
10. *Kohler H.* Surf. Sci., 1980, **98**, 378.
11. *Wakabayashi J., Kimura S., Kawaji S.* Surf. Sci., 1986, **170**, 359.
12. *Пудалов В.М., Семенчинский С.Г., Эдельман В.С.* Письма в ЖЭТФ, 1985, **41**, 265.
13. *Кукушкин И.В., Тимофеев В.Б..* Письма в ЖЭТФ, 1984, **40**, 413.
14. *Кукушкин И.В., Тимофеев В.Б.* Письма в ЖЭТФ, 1986, **43**, 387.
15. *Кукушкин И.В., Тимофеев В.Б.* ЖЭТФ, 1987, **92**, 258.
16. *Ando T., Uemura Y.* J. Phys. Soc. Japan, 1974, **37**, 1044.
17. *Englert T., Klitzing K.V.* Surf. Sci., 1978, **73**, 70.